



## Oprogramowanie do spektrometrów Xenometrix



Program nEXT jest kompatybilny z systemem Windows. Umożliwia w prosty sposób prowadzenie szybkich analiz jakościowych i ilościowych.

Cechy: automatyczna kontrola układu wzbudzenia i detekcji, zbierania i magazynowania danych.

Analiza jakościowa bazująca na położeniu linii energetycznych KLM, oznaczanie położenia pików sumarycznych i pików ucieczki. Różne możliwości prezentacji wykresów w skali logarytmicznej, liniowej, unipolarnej, bipolarnej. Automatyczna identyfikacja pików.

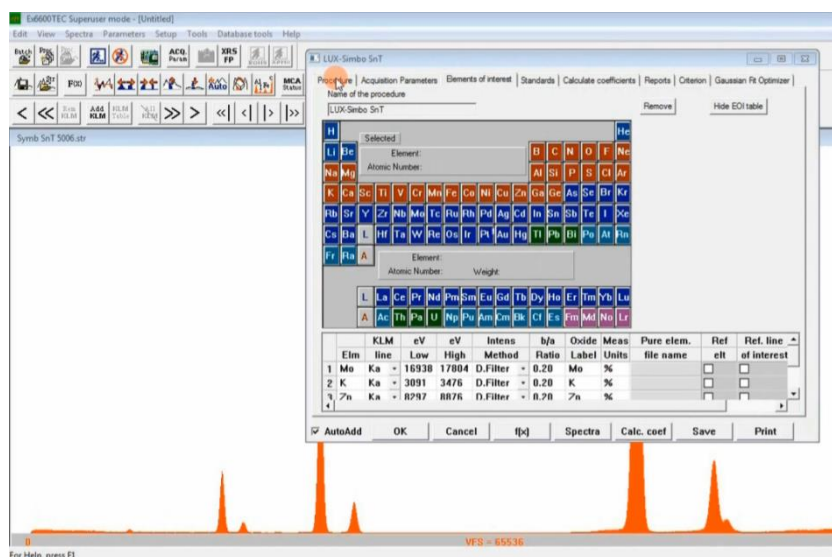
### Pakiet nEXT™

- zarządzanie pracą spektrometru
- definiowanie procedur pomiarowych
- tworzenie i modyfikacja metod pomiarowych itp.



### Moduł EasyLauncher™

- łatwy dostęp do modułów sterujących i analitycznych
- upgrade oprogramowania
- zdalny kontakt z centrum serwisowym producenta




## Oprogramowanie nEXt



### Dwa tryby pracy:

- tryb użytkownika do wykonywania pomiarów wg zapisanych procedur
- tryb administratora do diagnostyki, modyfikacji i tworzenia nowych procedur pomiarowych (możliwość tworzenia list zadań dla złożonych procedur)



Copyright: Xenematrix 2008

User Name

Password

Initialization mode

Mode

Superuser

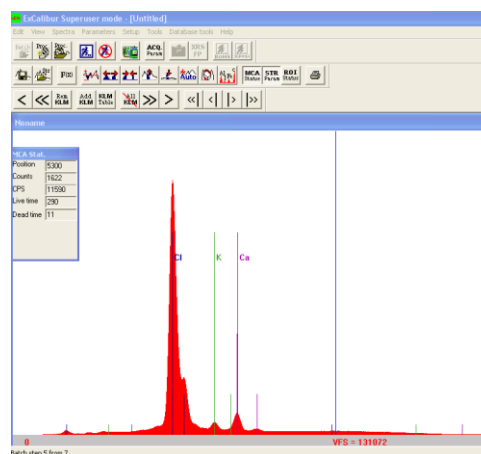
NEXT>>

<< BACK

Partial init

### Obrabianie widm:

- Nakładanie, skalowanie i porównywanie widm
- Dodawanie i odejmowanie widm
- Matematyczna obróbka
- Identyfikacja pików
- Automatyczne usuwanie pików ucieczki
- Korekcja tła
- Rozdzielanie pików
- Statystyka graficzna

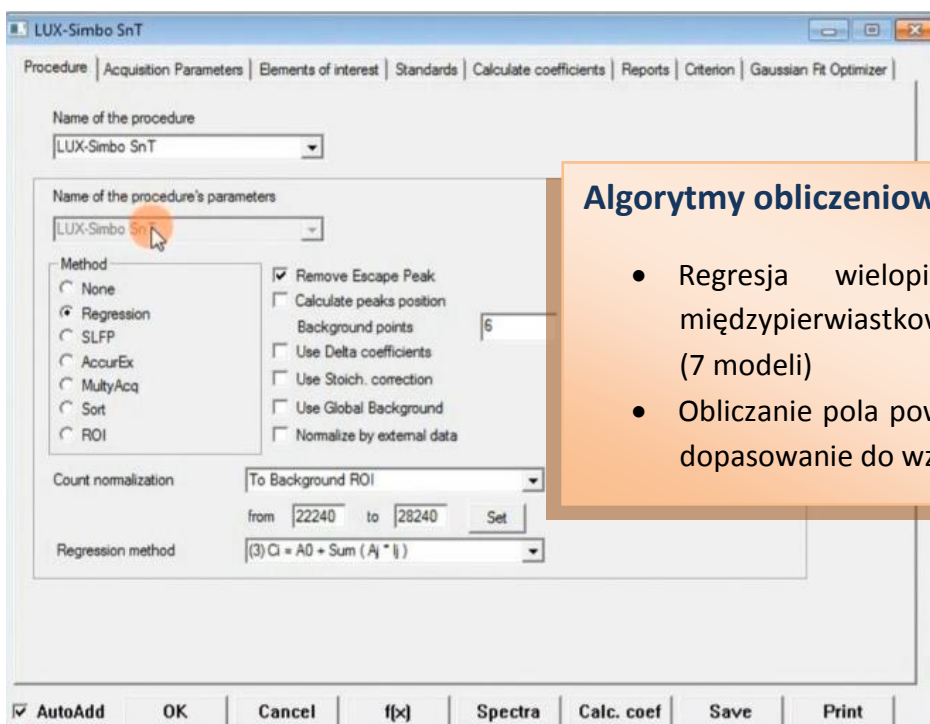


## Oprogramowanie nEXt



### Analiza ilościowa

- metody empiryczne i półempiryczne porównujące próbki do wzorców (krzywe kalibracyjne)
- algorytmy analizy bezwzorcowej SLFP (StandardLess Fundamental Parameters) dla próbek z matrycą zawierającą pierwiastki lekkie, stopy metali, tlenki,
- metody łączone
- tryb „best match” wyszukujący najlepiej dopasowane widma z zapisanej bazy



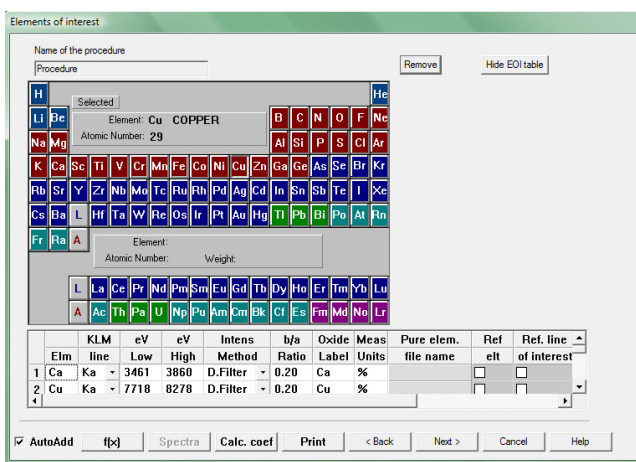
### Algorytmy obliczeniowe

- Regresja wielopierwiastkowa i korekcje międzypierwiastkowe intensywności i stężenia (7 modeli)
- Obliczanie pola powierzchni pików netto, brutto, dopasowanie do wzorca (FP), filtry cyfrowe itp.

### Bazy danych

Baza danych widm, procedur i skryptów w formacie MS Access

Dopasowywanie nowych widm do widm z bazy

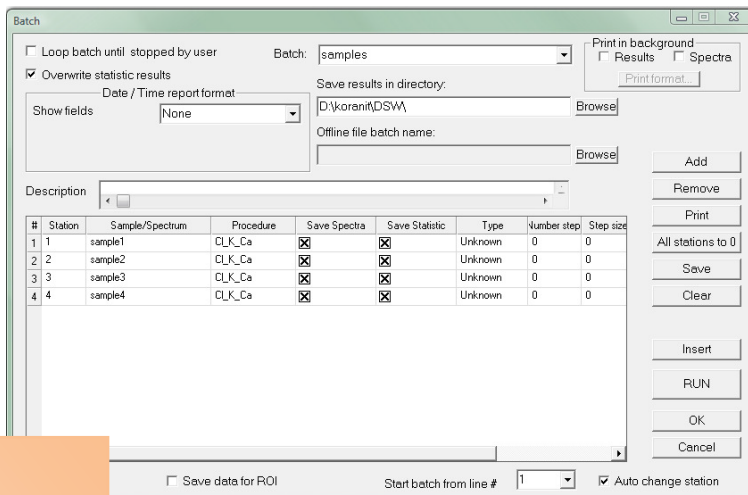




## Oprogramowanie nEXT



Definiowanie procedur i złożonych skryptów np. do optymalizacji analiz śladowych zawartości pierwiastków w próbce



#	Station	Sample/Spectrum	Procedure	Save Spectra	Save Statistic	Type	Number step	Step size
1		sample1	CL_K_Ca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Unknown	0	0
2		sample2	CL_K_Ca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Unknown	0	0
3		sample3	CL_K_Ca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Unknown	0	0
4		sample4	CL_K_Ca	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Unknown	0	0

## Raporty

- Prezentacja wyników w formie raportów liczbowych i graficznych
- Raporty generowane w formacie definiowanym przez użytkownika
- Możliwość ustalania limitów dla testów typu **spełnia / nie spełnia**
- Możliwość eksportu wszystkich parametrów do programów MS Word i MS Excel
- Oprogramowanie niezwykle elastyczne. Modyfikowane na potrzeby procedur mogą być praktycznie wszystkie parametry analiz i sprzętu.



## Program Advanced Fundamental Parameters SLFP (opcja)

- Kompletna analiza XRF bezwzorcowa SLFP, z użyciem wewnętrznej zaawansowanej bazy danych parametrów fundamentalnych (FP) uwzględniająca m.in.: współczynniki absorpcji dla poszczególnych pierwiastków, wydajność fluorescencyjną, prawdopodobieństwa przejść itd., możliwość modelowania zachowania detektora i źródła promieniowania i wiele innych możliwości.